

【試場規則】

- 一、憑鑑定證入場，並遵守一切試場規則；為提高鑑定試場品質安寧，測驗期間家長不得入校。
- 二、施測時應按時進入試場，遲到逾15分鐘者不得入場；施測後未滿30分鐘，不得離場。
- 三、請按照編號入座，在開始作答前應先檢查測驗畫紙、鑑定證及座位三者之號碼是否相同，如有不同，應立即舉手請施測人員處理。
- 四、施測時需將鑑定證放於桌面或畫板左上角，以便查驗。
- 五、除了自備使用的畫具外〈畫板由考場供應〉，不得攜帶其他任何紙張、畫稿、書籍、通訊用具〈含望遠鏡、手機、智慧手錶(手環)、攝錄影機等3C產品〉等用品進入試場，若攜帶以上違規物品，經制止仍未改善，違者扣該科成績2分。
- 六、試卷上之號碼條不得自行撕毀、塗改或剪除，違者扣該科成績2分。
- 七、請在測驗畫紙上作答，並不得書寫姓名或任何與施測內容無關之文字及符號，違者視情節輕重扣該科成績3至5分。
- 八、試場備有吹風機，使用須於試場規範區域內使用。
- 九、試場中不得有飲食(飲用水除外)、交談、暗示、惡意抄襲、甩水、頂替或其他舞弊情事及影響其他人之權益，違者視情節輕重，予以不記分或取消鑑定資格處分。
- 十、測驗未正式開始即翻閱試卷，經制止仍未停止，扣該科成績2分；測驗時間終了鈴聲響畢後，應即停止作答，經制止仍繼續作答，違者扣該科成績2分。
- 十一、請自行預留時間，以便畫面充分乾燥；如因畫面未乾致損壞畫面影響成績，概自行負責。
- 十二、參加鑑定考生應依規定時間交卷出場，不得停留或高聲喧嘩，經制止仍未停止喧嘩者，扣該科成績2分。
- 十三、試題紙應隨試卷一併繳回，不得攜出試場；攜出試場者取消鑑定資格。
- 十四、違反以上規定，將提報鑑定小組，視情節輕重予以扣分或取消資格處分。
- 十五、如有未盡事宜，悉依鑑定小組決議辦理。